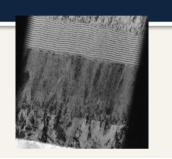
穿透式電子顯微鏡(TEM)特點

多層狀結構的厚 度量測



奈米顆粒量測和 分佈





達到原子等 級解析度

判斷材料晶體結 構





晶柱尺寸量測和 分佈(暗場像)

材料成分分析 (STEM/EDS)





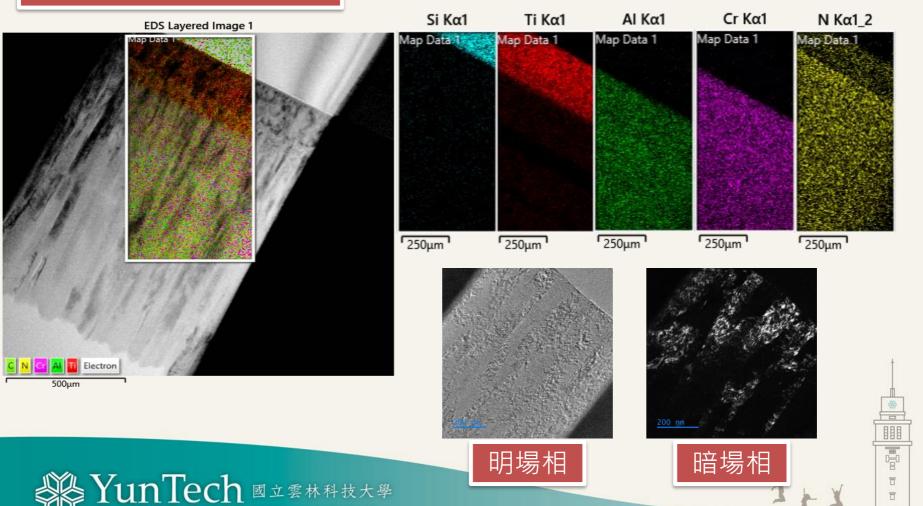
16



STEM檢測項目-Mapping、明場相、暗場相

STEM表面元素分佈分析

National Yunlin University of Science & Technology



17